

電気学会 第2回フォト・スピントロニクス技術調査専門委員会

日時：平成23年 7月22日（金） 13時 00分～ 16時 20分

場所：日本大学工学部駿河台校舎5号館2階 524会議室

[<http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/index.html>]

共催： IEEE Magnetics Society Japan Chapter, IEEE Magnetics Society Nagoya Chapter



JR 中央線	御茶ノ水駅	下車徒歩 3分
千代田線	新御茶ノ水駅	下車徒歩 3分
丸ノ内線	御茶ノ水駅	下車徒歩 5分
都営新宿線	小川町駅	下車徒歩 10分

プログラム

13:00-14:15 IEEE Distinguished Lecturer 講演会

”Magnetic Soft X-Ray Microscopy: A path towards imaging magnetism down to fundamental length and time scales”,

Dr. Peter Fischer (Lawrence Berkeley National Laboratory, 2011 IEEE Distinguished Lecturer)

14:15-14:35 休憩

14:35-15:25

"Development of depth-resolved XMCD technique with atomic-layer resolution and prospects for three-dimensional magnetic analysis"

Dr. Kenta Amemiya (High Energy Accelerator Research Organization)

15:25-16:15

"Dynamics of spin structure in micron-sized ferromagnetic elements using time-resolved XMCD-PEEM"

Dr. Keiki Fukumoto, (Tokyo Institute of Technology)

16:30 懇親会（参加費 3,000 円）

懇親会参加希望の方は、1週間前までに加藤までご連絡下さい。参加費は当日徴収いたします。